

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium

RJL Micro und Analytic Bernhard E. Heneka GmbH
Gesellschaft für angewandte Elektronenmikroskopie und Analytik
Im Entenfang 11, 76689 Karlsdorf-Neuthard

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

automatische Teilchenanalytik (Anzahl, Größe und chemische Zusammensetzung) mittels computergesteuerter Rasterelektronenmikroskopie und EDX-Elementanalyse;
automatische Teilchenzählung und -vermessung mittels Scanner;
gravimetrische Analyse der Partikelmasse mittels Laborwaage;
Restschmutzextraktion und Filtration;
Röntgen-Mikrotomographie und digitale Radiographie

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 08.06.2016 mit der Akkreditierungsnummer D-PL-11311-01 und ist gültig bis 07.06.2021. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 4 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-PL-11311-01-00**

Berlin, 08.06.2016



Im Auftrag Ralf Egner
Abteilungsleiter

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). Ausgenommen davon ist die separate Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in unveränderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die über den durch die DAkKS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30). Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11311-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 08.06.2016 bis 07.06.2021

Ausstellungsdatum: 08.06.2016

Urkundeninhaber:

RJL Micro und Analytic Bernhard E. Heneka GmbH
Gesellschaft für angewandte Elektronenmikroskopie und Analytik
Im Entenfang 11, 76689 Karlsdorf-Neuthard

Prüfungen in den Bereichen:

**automatische Teilchenanalytik (Anzahl, Größe und chemische Zusammensetzung) mittels
computergesteuerter Rasterelektronenmikroskopie und EDX-Elementanalyse;**
automatische Teilchenzählung und -vermessung mittels Scanner;
gravimetrische Analyse der Partikelmasse mittels Laborwaage;
Restschmutzextraktion und Filtration;
Röntgen-Mikrotomographie und digitale Radiographie

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

**Innerhalb der mit * gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass
es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von
genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.
Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine
aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

1 Rasterelektronenmikroskopie

1.1 Partikelanalytik für die Prüfung der Technischen Sauberkeit*

ISO 16232-7 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 7: Particle sizing and counting by microscopic analysis
ISO 16232-8 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 8: Particle nature determination by microscopic analysis
ISO 16232-10 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 10: Expression of results
VDA 19 Teil 1 2015-03	Prüfung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigungen funktionsrelevanter Automobilteile (hier: <i>Kapitel 8: Analyseverfahren, Abschnitt 8.3.2 REM-EDX</i> <i>Kapitel 9: Dokumentation</i>)

1.2 Teilchenanalytik allgemein

Hausverfahren PSEM AFA-01 2006-01	Elektronenoptische Untersuchungen von Oberflächen und Partikel- filtern mittels Rasterelektronenmikroskop und EDX-Elementanalyse mit integrierter Auswertungssoftware
---	---

2 Optische Partikelzählung

2.1 Partikelzählung für die Prüfung der Technischen Sauberkeit*

VDA 19 Teil 1 2015-03	Prüfung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigungen funktionsrelevanter Automobilteile (hier: <i>Kapitel 8: Analyseverfahren, Abschnitt 8.2.2 Lichtoptische Analyse</i> <i>Kapitel 9: Dokumentation</i>)
--------------------------	---

2.2 Partikelzählung allgemein

Hausverfahren MQ AFS-01 2006-01	Automatische Teilchenzählung und -vermessung auf Partikelfiltern mittels hochauflösendem Scanner mit integrierter Auswertungssoft- ware
---------------------------------------	---

3 Gravimetrische Analyse für die Prüfung der Technischen Sauberkeit *

ISO 16232-6 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 6: Particle mass determination by gravimetric analysis
ISO 16232-10 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 10: Expression of results
VDA 19 Teil 1 2015-03	Prüfung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigungen funktionsrelevanter Automobilteile (hier: <i>Kapitel 8: Analyseverfahren, Abschnitt 8.2.1 Gravimetrie</i> <i>Kapitel 9: Dokumentation</i>)

4 Restschmutzextraktion und Filtration für die Prüfung der Technischen Sauberkeit*

ISO 16232-2 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 2: Method of extraction of contaminants by agitation
ISO 16232-3 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 3: Method of extraction of contaminants by pressure rinsing
ISO 16232-4 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 4: Method of extraction of contaminants by ultrasonic techniques
ISO 16232-10 2007-06	Road Vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 10: Expression of results
VDA 19 Teil 1 2015-03	Prüfung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigungen funktionsrelevanter Automobilteile (hier: <i>Kapitel 5: Qualifizierungsuntersuchung und Blindwert</i> <i>Kapitel 6: Extraktionsverfahren</i> <i>Kapitel 7: Analysefiltration</i> <i>Kapitel 9: Dokumentation</i>)

5 Röntgenmikrotomographie

Hausverfahren MCT-DXR 2014-09	Röntgen-Mikrotomographie und digitale Radiographie zur Analyse der inneren und äußeren räumlichen Struktur von Werkstoffen, Komponenten und Produkten
-------------------------------------	---

verwendete Abkürzungen:

ISO	International Organization for Standardization
VDA	Verband der Automobilindustrie